



# Les nouveaux outils de diagnostic dans les processus industriels

Les clés de la compétitivité



JOURNÉE SEE-AAI, GDRMACS-S3  
PARIS 04/MARS/08

## Thème

La synthèse d'un système de diagnostic peut s'opérer suivant deux types d'approches: les méthodes quantitatives et les méthodes qualitatives. Les méthodes quantitatives se basent sur la connaissance d'un modèle mathématique du processus, méthodes qualitatives reposent sur le savoir faire de l'ingénieur ayant une très bonne maîtrise de l'installation à surveiller.

La journée proposée réunira industriels et universitaires dans le but d'échanger et de dégager des besoins et attentes d'intérêt commun. Le thème est le diagnostic qu'il s'agisse du diagnostic d'un (Micro/Nano) système, d'un équipement ou d'un processus industriel.

Aujourd'hui tous les industriels s'intéressent aux nouvelles technologies qui leur permettront d'améliorer le diagnostic et d'accroître leur compétitivité. En effet, réduire le temps de mise en service, optimiser le temps de fonctionnement, en plus des exigences de disponibilité, constituent des préoccupations communes à presque tous les secteurs et ceci qu'il s'agisse des domaines des transports, de l'aéronautique, du spatial, de l'énergie, de l'environnement, de l'agroalimentaire, de la santé...

L'objectif de cette journée est de présenter des applications utilisant des techniques de diagnostic industriel de systèmes tels que les réseaux de télécommunications, les équipements en service dans une usine, les véhicules automobiles, les circuits électroniques... et de mettre en évidence les insuffisances éventuelles de ces techniques et les améliorations que l'on peut leur apporter.

Contact: M. CHADLI, MIS, 7 Rue Moulin Neuf 80000 AMIENS. Tel : 03.22. 82 76 80, e-Mail: mohammed.chadli@u-picardie.fr

## Lieu

ESIEE  
2 boulevard Blaise Pascal  
Cité DESCARTES  
93162 - Noisy le Grand

Accès RER A Station Noisy-Champs

## Renseignements et inscriptions

(voir formulaire d'inscription au verso)

## SEE

17 rue de l'Amiral Hamelin – 75783 Paris Cedex 16  
Tél : +33 (0)1 56 90 37 09 Fax : +33 (0)1 56 90 37 19  
e-mail : [solange.lebrun@see.asso.fr](mailto:solange.lebrun@see.asso.fr) – web : [www.see.asso.fr](http://www.see.asso.fr)

**Mardi 04 Mars 2008**

de 08h30 à 17h45

2, boulevard Blaise Pascal  
Cité DESCARTES  
93162 Noisy le Grand

## Programme

8h30	Accueil
9h00	Introduction de la journée
9h15	<b>F. Grzesiak (PROSYST)</b> , « Diagnostic Automatique » une nouvelle approche de diagnostic machine basée sur l'exécution d'un modèle structurel
10h00	Pause
10h15	<b>Z. Sabe, J. Ragot, D. Maquin (CRAN)</b> , Modélisation et surveillance de la boucle des gaz dans un moteur diesel suralimenté à injection directe. Principes généraux du diagnostic de systèmes.
11h00	<b>N. Charkaoui (PSA)</b> , Amélioration de la démarche de recherche de pannes en après-vente
11h45	<b>B. OuldBouamama, M. Djeziri, R. Merzouki (LAGIS)</b> , Conception intégrée des systèmes de supervision industrielle: théorie et application
12h30	Repas
14h00	<b>P. Kiener (NETRAL)</b> , Implémentation de réseaux de neurones pour le diagnostic sur co-processeur AIDIAG.
14h45	<b>D. Theilliol, C. Aubrun, P. Weber (CRAN)</b> , Surveillance de systèmes industriels fondée sur les méthodes de diagnostic à base de modèles
15h30	Pause
15h45	<b>J.-B. Leger (PREDICT)</b> , Surveillance et diagnostic de dégradation basés sur le couplage d'approches quantitative et qualitative : plate-forme CASIP/KASEM et applications industrielles.
16h30	<b>J. Thomas (ACTIA)</b> , Diagnostic à base de connaissances hétérogènes: application au domaine de l'automobile
17h15	Débat/Conclusion
17h45	Fin de la journée



# Les nouveaux outils de diagnostic dans les processus industriels

Les clés de la compétitivité



JOURNÉE SEE-AAI, GDRMACS-S3  
PARIS 04/MARS/08

## BULLETIN D'INSCRIPTION

### CONFERENCE «Les nouveaux outils de diagnostic dans les processus industriels-Les clés de la compétitivité» Mardi 04 Mars 2008 – de 8h30 à 17h30

A retourner par fax ou par courrier à :

SEE - 17 rue de l'Amiral Hamelin - 75783 Paris Cedex 16 - Tél : +33 (0)1 56 90 37 09 Fax : +33 (0)1 56 90 37 19

NOM (en capitales) et Prénom : \_\_\_\_\_  
Société/Organisme payeur : \_\_\_\_\_  
Adresse : \_\_\_\_\_  
Fonction et/ou Service : \_\_\_\_\_ Nom du Responsable Paiement \_\_\_\_\_  
Tél : \_\_\_\_\_ Fax : \_\_\_\_\_  
E-mail : \_\_\_\_\_

### DROITS D'INSCRIPTION (TVA 19,6% comprise) (comprenant l'accès aux séances & le recueil des présentations)

	TARIFS EN EUROS TTC
Tarif professionnels non membres de la SEE	195.00 €
Tarif universitaires et professionnels membres de la SEE	145.00 €
Etudiant non membre	25 €
Etudiant membre SEE	0.00 €(*)

(\*) Accès gratuit pour étudiant membre SEE ou accompagné  
par un participant payant dans les limites du quota disponible à cet effet

⇒ cocher le tarif correspondant

### PAIEMENT

par chèque bancaire ou chèque postal à l'ordre de la SEE

par virement bancaire (prière de joindre une copie du virement avec le nom des participants) à notre compte  
BNP Paribas – Agence Paris Maine Montparnasse

Code Banque      Guichet      N° de compte      RIB  
30004              00274              00010336242      58      (frais bancaires à votre charge)

par virement SWIFT Code BNPA FRP PXXX

par prélèvement sur carte de crédit (Eurocard/Mastercard, American Express, Visa, Carte Bleue, Diners Club International)  
n° (16 chiffres) \_\_\_\_\_ Date d'expiration \_\_\_\_\_

signature/autorisation

### Lieu

ESIEE  
2 boulevard Blaise Pascal  
Cité DESCARTES  
93162 - Noisy le Grand

### Accès RER A Station Noisy-Champs Renseignements

#### Inscriptions et renseignements pratiques :

SEE – 17 rue de l'Amiral Hamelin, 75783 PARIS Cedex 16 - Tél : +33 (0)1 56 90 37 09 – Fax : +33 (0)1 56 90 37 19

e-mail : [solange.lebrun@see.asso.fr](mailto:solange.lebrun@see.asso.fr)

- Pour toute annulation d'inscription intervenant moins de 8 jours avant la manifestation, les droits d'inscription seront dus en totalité.
- Une convention de formation est disponible sur simple demande.